

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ РbTe и Pb_{1-x}Mn_xTe В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

АГАЕВ З.Ф., БАГИЕВА Г.З., АЛЛАХВЕРДИЕВ Э.А., ИСМАЙЫЛОВА Р.А., ЮСИФОВ В.В., АБДИНОВ Д.Ш.

Институт Физики НАН Азербайджана, Баку AZ-1143, пр. Джавида 33

Приведены результаты исследований по влиянию магнитного поля на ρ , R_x и α монокристаллов $Pb_{1,x}Mn_xTe$, прошедших и не прошедших отжиг после их выращивания. Полученные результаты объяснены существованием в этих кристаллах двух валентных зон и изменением расстояний между этими зонами с температурой и концентрацией атомов марганца.

Кристаллы РbTe и твердые растворы на его основе используются для изготовления различных приборов, в частности термоэлектрических устройств и приемников инфракрасного излучения и поэтому интенсивно исследуются [1]. Однако, в основном, исследования проведены в системах аналогов, таких как PbTe-SnTe, PbTe-GeTe и т.д. [2,3], в которых наблюдается уменьшение ширины запрещенной зоны при образовании твердого раствора. В последние годы интенсивно исследуются полумагнитные твердые растворы на основе PbTe, в том числе Pb_{1-x}Mn_xTe [4]. При образовании указанного твердого раствора сильно возрастает ширина запрещенной зоны E_o(dE_o/dx=3,4 эВ) и в магнитном поле происходит изменение энергетического спектра носителей заряда благодаря их обменному взаимодействию c электронами магнитных ионов марганца [5]. В связи с этим исследования влияния магнитного поля на физические свойства монокристаллов Pb_{1-x}Mn_xTe представляют определенный научный и практический интерес.

В данной статье приводятся данные по влиянию магнитного поля на удельное сопротивление ρ , коэффициенты Холла R_x и тэрмоэдс α моно-кристаллов $Pb_{1,x}Mn_xTe$ (0 $\leq x \leq 0,4$) при ~77 К и 300 К.

На рис. 1 представлены данные по зависимости $\Delta \rho / \rho_0$ (магнетосопротивление) от индукции магнитного поля В для различных образцов монокристаллов PbTe до и после отжига, соответственно. Кривые 2 и 3 на рис. 1 (*a*) соответствуют образцам, обладающими при 77 К *p* – типом проводимости, а кривая 3 *n* – типом проводимости. После отжига при ~ 400⁰ С в

атмосфере спектрально чистого аргона в течение ~120 часов все образцы обладали *n* – типом проводимости.

В таблице 1 приведены исходные параметры исследованных образцов. Концентрация и подвижность электронов и дырок вычислены из данных коэффициента Холла (R_x), измеренного при B=0,55 Тл по формуле для одного типа носителей заряда.

Из данных рис. 1 и таблицы 1 следует, что в образцах *p*- типа проводимости магниторезистивный эффект при $B \le 0,55$ Тл незначителен (в порядке ~ 2 – 3%). Образцы же с *n* – типом проводимости обладают достаточно высоким магниторезистивным эффектом. Это обусловлено, в первую очередь, высокой подвижностью электронов относительно дырок в образцах PbTe. После отжига все образцы становятся полупроводниками с *n* – типом проводимостью и в них усиливается магниторезистивный эффект.

В PbTe существует вторая валентная зона с относительно большой эффективной массой (около $1,2m_0$). Энергетический зазор между краями зон легких и тяжелых дырок при при 0К равен ~0,17 эВ и с ростом температуры уменьшается со скоростью $4 \cdot 10^{-4}$ эв/К так, что расстояние между краями зоны проводимости и зоны тяжелых дырок остается неизменным. При температуре ~450К энергетический зазор между валентными зонами исчезает (при ~ 300К он равен ~ 0,04 эВ), а при дальнейшем росте температуры край зоны тяжелых дырок находится выше края зоны легких дырок и ширина запрещенной зоны, равная теперь энергетическому расстоянию между краями зоны проводимости и зоны тяжелых со скоростье така.

дырок, не зависит от температуры и равна ~0,36 эВ.

С введением атомов марганца в PbTe происходит расширение ширины запрещенной зоны, т.е. атомы Mn влияют на E_g так же, как и температура, и E_g в этом случае растет за счет уменьшения зазора между краями зон легких и тяжелых дырок[6]. Таким образом, с введением Mn в PbTe растет концентрация тяжелых дырок и средняя эффективная масса дырок. В результате в составах $Pb_{1-x}Mn_x$ Te магниторезистивный эффект становится меньше (в порядке ошибки эксперимента), чем в образцах PbTe.

В области слабых магнитных полей ($\mu^2 B^2 << 1$) с ростом поля коэффициент Холла уменьшается пропорционально B^2 и эта зависимость выражается соотношением [7]:

$$R_{B} = R_{0} \left[1 - M_{d}^{2} B^{2} \left(A^{2} - 2 C - \frac{D}{A} \right) \right]$$

здесь



где т - время свободного пробега носителей заряда.

Видно, что коэффициент пропорциональности в зависимости R_x от В зависит от квадрата подвижности и механизма рассеяния. Следовательно, исследуя зависимость R_x от В при слабых полях можно получить информацию о механизме рассеяния носителей заряда.

На рис. 2 представлены зависимости R_x от квадрата индукции магнитного поля (B^2) при ~77К (рис.2.*a*) и ~300К (рис. 2.*b*) для образцов, прошедших и не прошедших термообработки.

В таблице 2 приведены значения R_0 и коэффициента пропорциональности $tg \varphi = M^2 \left(A^2 - 2C + \frac{D}{A} \right)$. Из этих данных следует, что для всех исследованных образцов

РbTе выполняется зависимость $R_x \sim B^2$ при магнитных полях до ~0,55 Tл. При ~77К значения tg φ для образцов больше, чем при 300К. Кроме того, после термообработки значение tg φ при ~77К несколько растет. Рост tg φ при уменьшении температуры от 300 до 77К обусловлен ослаблением рассеяния носителей заряда от колебаний решетки и усилением рассеяния на ионизированных точечных дефектах.



Рис.1. Зависимость Δρ/ρ₀ от индукции магнитного поля В, для образцов PbTe, не прошедших (*a*) и прошедших (*b*) термическую обработку при 400⁰С в течении 120 часов в атмосфере спектрально чистого аргона.



Рис. 2. Зависимость коэффициента Холла в магнитном поле от квадрата индукции магнитного поля при 77К(а) и 300К(б) для различных образцов PbTe, не прошедших (кривые 1 – 4) и прошедших (кривые 1' - 3') отжиг.

Таблица 1

Электрофизические параметры образцов PbTe до и после термообработки.

Образцы РbТe	Тип проводимости	77К					зодимости	300К				
		σ Ом ⁻¹ см ⁻¹	а мкВ/К	R _x см ³ /Кл	<i>n</i> ×10 ⁻¹⁸ см ⁻³	μ см²/(В·с)	Тип пров	Ом ⁻¹ см ⁻¹	α мкВ/К	R _x см ³ /Кл	<i>n</i> ×10 ⁻¹⁸ см ⁻³	μ см²/(В·с)
№ 1	п	2603	114,4	0,95	6,6	2473	п	58.8	270.5	2.5	2.5	147
N <u>⁰</u> 2	р	3,5	144,6	13	0,5	45,5	р	221.5	277	1.95	3.2	432
<u>№</u> 3	р	21.3	31.9	3.9	1.61	83.1	р	55.9	275.2	2	3.14	111.8

До термообработки

После термообработки

Образцы РbTe	Тип проводимости	77К					водимости	300К				
		Ом ⁻¹ см ⁻¹	а мкВ/К	см ³ /Кл	<i>n</i> ×10 ⁻¹⁸ см ⁻³	μ см²/(В·с)	Тип прон	Ом ⁻¹ см ⁻¹	α мкВ/К	R _x см ³ /Кл	<i>n</i> ×10 ⁻¹⁸ см ⁻³	μ см²/(В·с)
№ 1	п	443.6	73.2	2.3	2.73	1019	п	42	162.5	1.7	3.7	71.4
<u>№</u> 2	n	926.6	66	1.3	4.8	1204	n	80	99	1.2	5.23	96
<u>№</u> 3	n	1157	80.7	1.6	3.93	1851	n	99	143.4	1.5	4.2	148.5

При термообработке происходит диффузия и равномерное распределение избыточных атомов теллура по всему объему и их частичное улетучивание (несмотря на то, что отжиг проводится в атмосфере аргона), вследствие чего образцы становятся полупроводниками с *n* – типом проводимости. Образовавшиеся дефекты усиливают процесс рассеяния носителей заряда от ионов, и соответственно, значение tgo при 77 К растет.

На рис. 3 показано влияние магнитного поля на коэффициент термоэдс α монокристаллов PbTe при температуре ~ 100 К. Образцы, не прошедшие термообработку при ~ 100 К обладают p – типом проводимости. Образец №3 до 100 К обладает n – типом проводимости. Из рис. 3 также следует, что заметное влияние магнитного поля на α наблюдается только в случае образца PbTe №3, не прошедшего термообработку. В других случаях изменение α под действием магнитного поля не превышает 5–6 %. При температуре 300 К изменение α в магнитном поле в порядке ~2-3% (порядка погрешности эксперимента).

При воздействии на образец магнитного поля, перпендикулярного направлению движения электронов, носители заряда отклоняются под действием силы Лоренца. При этом, носители которые слабее рассеиваются и поэтому имеют большее время свободного пробега в магнитном поле, отклоняются больше, чем сильно рассеивающиеся носители. В образцах PbTe при 100 К преимущественный вклад имеет рассеяние электронов и дырок на акустических фононах, которому быстрые носители подвержены в большей степени, чем медленные. Поэтому магнитное поле в основном отклоняет носители с меньшей энергией, и их вклад в ток уменьшается.



Рис. 3. Зависимость коэффициента тэрмоэдс от индукции магнитного поля для различных образцов РbTe n – (кривая 1) и p – типов (2, 3, 1', 2'), не прошедших термическую обработку. Кривые 1 – 3 при 77К, кривые 1' – 2' при 300К.

Таблица 2

Образцы РbTe		77	νK		300К				
	До термос	обработки	После терм	ообработки	До термос	обработки	После термообработки		
	tgφ	R ₀	tgφ	R ₀	tgφ	R ₀	tgφ	R ₀	
№ 1	-4·10 ⁻⁷	10 ⁻⁶	-7·10 ⁻⁷	2,4.10-6	-2,6.10-7	2,6.10-6	-4,1·10 ⁻⁷	1,7.10-6	
N <u>⁰</u> 2	-4,3·10 ⁻⁷	2,6.10-5	-8,2·10 ⁻⁷	1,5.10-5	-5,2·10 ⁻⁷	1,8.10-5	-2·10 ⁻⁷	1,2.10-5	
N <u>∘</u> 3	-1,1.10-6	$4 \cdot 10^{-6}$	-9,3·10 ⁻⁶	9,3·10 ⁻⁶	-6·10 ⁻⁶	$2 \cdot 10^{-6}$	-6·10 ⁻⁶	1,6.10-6	

Значения R₀ и tgφ для различных образцов PbTe.

Подвижность носителей заряда с большей энергией в исследованных образцах PbTe мала, влияние магнитного поля на среднюю энергию носителей и следовательно, на коэффициент термоэдс невысокое. Судя по значению коэффициента Холла R_x, образец

№3 обладает более совершенной структурой и подвижностью дырок при ~ 100 К. Этим и обусловлено заметное (до ~ 18%) увеличение α в этом образце под действием магнитного поля.

- [1]. Гавалешко Н.П., Горлей П.Н., Шендеровский В.Л. Узкозонные полупроводники. Получение и физические свойства. Киев.: Наукова Думка. 1984. 287 с.
- [2]. Патли Е. Сульфид, селенид и теллурид свинца. В сб. Материалы используемые в полупроводниковых приборах. Под ред. К.Хогарта. М.: Мир.1968. С. 99-143.
- [3]. Равич Ю.И. О свойствах халькогенидах свинца. В сб. Материалы используемые в полупроводниковых приборах. Под ред. К.Хогарта. М.: Мир.1968.

C. 273-301.

- [4]. Gorska M., Anderson I.R. Phys. Rew. B. 1988. V.38.№13. P. 9120-9126.
- [5]. Засавицкий И.И., Ковальчик Л., Мацонашвили Б.Н., Сазонов А.В. ФТП. 1988. Т.22. №12. С. 2118-2123.
- [6]. Агаев З.Ф., Аллахвердиев Э.А., Муртузов Г.М., Абдинов Д.Ш. Неорганические материалы. 2003. Т.39. №5. С.543-545.
- [7]. Киреев П.С. Физика полупроводников. М.: Высшая школа. 1975. 584с.